

General Scientific Networking Meeting of NEMO

University of Santiago de Compostela, Optics and Optometry School
(Escuela de Optica y Optometria)

Santiago de Compostela, Hiszpania, 26.06 – 3.07.2008

Prezentacje:

- ❑ **M.Jóźwik** : *Opto-numerical methodology and measurement system for DOE elements testing and prototyping*
- ❑ **J.Kreżel** : *Integrated Microinterferometric Sensor (IMS)*
- ❑ **R.Krajewski**: *AOP: Microinterferometric Tomography System (MiTS)*



za prezentację mgr inż. Jerzy Kreżel otrzymał nagrodę



Plakaty:

□ C.Gorecki, J.Albero, Ł.Nieradko, K.Krupa, M.Józwik, J.Kacperski, M.Kujawińska :
Implementation of high-resolution characterisation methods for MEMS/MOEMS

□ M.Wissmann, M.Kujawińska, H.Thienpont :
Microinterferometric Tomography System (MiTS)





